

Д. т. н. В. М. НИКОЛАЕНКО, к. т. н. О. В. НИКОЛАЕНКО

Украина, г. Одесса, Гос. политехнический ун-т
E-mail: NVM@RTF.OSPU.ODESSA.UA

Дата поступления в редакцию
14.11 2000 г.
Оппонент д. т. н. А. И. КАЗАКОВ

АППРОКСИМАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК МАКРОМОДЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ МЕТОДОМ ГЛАДКОЙ КРИВОЙ

Метод гладкой кривой позволяет аппроксимировать характеристики термозависимых макромоделей электронных устройств с требуемой точностью и ограниченной кривизной.

Автоматизированное схемотехническое и функционально-логическое проектирование электронной аппаратуры (ЭА) основано на использовании макромоделей и гипермоделей входящих в ее состав устройств, характеристики которых являются функциональными зависимостями от ряда параметров, в том числе и температуры [1,2]. При этом формирование указанных машинных представлений базируется на экспериментальных и справочных данных, требующих применения аппроксимации как процедуры их компактного описания [3].

Естественные процессы, протекающие в полупроводниковых приборах и пассивных элементах ЭА, в основном носят плавный характер, без проявления резких выбросов, в то время как традиционные методы аппроксимации нелинейных зависимостей, например, на основе полиномов Лагранжа, Ньютона, Бесселя, Якоби и др. [4], не гарантируют выполнение вышеотмеченной особенности. В определенной степени рассматриваемая задача может быть решена, если воспользоваться методом на основе сглаженной сплайн-аппроксимации [5] или методом со сглаживающим дополнением [6]. Однако отдельные недостатки этих методов стимулируют дальнейшее развитие этого направления. В частности, предлагаемый метод *гладкой кривой* позволяет реализовать сглаженную аппроксимацию характеристик электронных устройств с минимумом квадратов их отклонений от заданных зависимостей.

В основу предлагаемого метода аппроксимации характеристик макромоделей электронных устройств положен следующий континуальный критерий:

$$\Lambda(\tilde{a}) = \sum_{T_1}^{T_m} \left\{ \alpha [g(\tilde{a}, \xi) - f(\xi)]^2 + \right. \quad (1)$$

$$+ \beta \left[\frac{\partial^2 g(\tilde{a}, \xi)}{\partial \xi^2} \right] \left/ \left(1 + \left(\frac{\partial g(\tilde{a}, \xi)}{\partial \xi} \right)^2 \right)^{\frac{3}{2}} - k(\xi) \right. \left. \right\} d\xi = \min,$$

где $\tilde{a} = \{a_0, \dots, a_n\}$ – параметры функции $g(\cdot)$, аппроксимирующей характеристику $f(\cdot)$;
 $k(\cdot)$ – заданные значения кривизны кривой, представляющей $f(\cdot)$;
 α и β – весовые коэффициенты составляющих критерия аппроксимации по точности и гладкости, соответственно;
 $[T_1, T_m]$ – интервал аппроксимации по аргументу T .

Квадратичный вид функции $\Lambda(\cdot)$ (1) позволяет записать условие ее минимума в виде

$$\frac{\partial \Lambda(\tilde{a})}{\partial a_k} = 0, \quad k = \overline{0, n}. \quad (2)$$

Дискретный аналог критерия (1) представим следующим образом:

$$\Lambda(\tilde{a}) = \sum_{i=1}^m \left\{ \alpha [g(\tilde{a}, T_i) - f_i]^2 + \right. \quad (3)$$

$$+ \beta \left[\frac{\partial^2 g(\tilde{a}, T_i)}{\partial T^2} \right] \left/ \left[1 + \left(\frac{\partial g(\tilde{a}, T_i)}{\partial T} \right)^2 \right]^{\frac{3}{2}} - k_i \right. \left. \right\}^2 = 0,$$

где $f_i = f(T_i)$, $k_i = k(T_i)$.

С учетом записи (3) условие (2) может быть представлено в форме

$$\begin{aligned} & \sum_{i=1}^m \left\{ \alpha [g(\tilde{a}, T_i) - f_i] \frac{\partial g(\tilde{a}, T_i)}{\partial a_k} + \beta \left[\frac{\partial^2 g(\tilde{a}, T_i)}{\partial T^2} - k_i A_i^{3/2} \right] \times \right. \\ & \times \left. \left[\frac{\partial^3 g(\tilde{a}, T_i)}{\partial T^2 \partial a_k} A_i - 3 \frac{\partial^2 g(\tilde{a}, T_i)}{\partial T^2} \frac{\partial^2 g(\tilde{a}, T_i)}{\partial T \partial a_k} \frac{\partial g(\tilde{a}, T_i)}{\partial T} \right] / A_i^4 \right\} = 0, \\ & k = \overline{0, n}, \end{aligned} \quad (4)$$

где $A_i = 1 + \left(\frac{\partial g(\tilde{a}, T_i)}{\partial T} \right)^2$.

Решение системы нелинейных уравнений (4) одним из традиционных методов [4, с. 190] позволяет определить параметры a_i ($i = \overline{0, n}$) аппроксимирующей функцией $g(\cdot)$ с минимумом суммы квадратов отклонений в заданных узлах T_i ($i = \overline{1, m}$), а также с минимумом суммы квадратов отклонений кривизны кривой $g(\cdot)$ от заданных значений k_i ($i = \overline{1, m}$).

ЭЛЕКТРОННАЯ АППАРАТУРА: ИССЛЕДОВАНИЯ, РАЗРАБОТКИ

При решении вышеописанной задачи аппроксимации часто удобно в качестве функции $g(\cdot)$ использовать алгебраический полином

$$g(\tilde{a}, T) = \sum_{s=0}^n a_s T^s, \quad (5)$$

возможность применения которого, как известно [7, с. 202], оговаривается теоремой Вейерштрасса.

Тогда система уравнений (4) с учетом выражения (5) примет вид

$$\begin{aligned} & \sum_{i=1}^m \left\{ \alpha \left(\sum_{s=0}^n a_s T_i^s - f_i \right) T_i^k + \beta \left[\sum_{s=2}^n s(s-1)a_s T_i^{s-2} - k_i B_i^{3/2} \right] \times \right. \\ & \left. \times \left[k(k-1)T_i^{k-2}B_i - 3 \left(\sum_{s=2}^n s(s-1)a_s T_i^{s-2} \right) \times \right. \right. \\ & \left. \times \left(\sum_{j=1}^n j a_s T_i^{j-1} \right) k T_i^{k-1} \right] / B_i^4 \right\} = 0, \quad k = \overline{0, n}, \quad (6) \\ & \text{где } B_i = 1 + \left(\sum_{s=1}^n s a_s T_i^{s-1} \right)^2. \end{aligned}$$

Соотношения (6) могут быть решены так же, как и система уравнений (4), на основе традиционных методов [7, с. 661]. Более эффективный путь их решения реализуется методом простой итерации или методом Зейделя [4, с. 207]. В последнем случае уравнения (6) приводятся к следующей форме:

$$\begin{aligned} a_0^{(p+1)} &= \frac{1}{m} \left[\sum_{i=1}^n f_i - \sum_{s=1}^n a_s^{(p)} \left(\sum_{i=1}^m T_i^s \right) \right]; \\ a_k^{(p+1)} &= \left(\sum_{i=1}^m T_i^{2k} \right)^{-1} \left\{ \sum_{i=1}^n f_i T_i^k - \sum_{s=0}^{k-1} a_s^{(p+1)} \left(\sum_{i=1}^m T_i^{s+k} \right) - \right. \\ & - \sum_{s=k+1}^n a_s^{(p)} \left(\sum_{i=1}^m T_i^{s+k} \right) - \frac{\beta}{\alpha} \sum_{i=1}^m \left[\sum_{s=2}^{k-1} s(s-1)a_s^{(p+1)} T_i^{s-2} + \right. \\ & + \sum_{s=k}^n s(s-1)a_s^{(p)} T_i^{s-2} - k_i C_i^{3/2} \left. \right] \left[k(k-1)T_i^{k-2}C_i - \right. \\ & \left. - 3 \left(\sum_{s=2}^{k-1} s(s-1)a_s^{(p+1)} T_i^{s-2} + \sum_{s=k}^n s(s-1)a_s^{(p)} T_i^{s-2} \right) \times \right. \\ & \left. \times \left(\sum_{j=1}^{k-1} j a_s^{(p+1)} T_i^{j-1} + \sum_{j=k}^n j a_s^{(p)} T_i^{j-1} \right) k T_i^{k-1} \right] / C_i^4, \quad k = \overline{1, n}, \quad (7) \end{aligned}$$

где $C_i = 1 + \left(\sum_{s=1}^{k-1} s a_s^{(p+1)} T_i^{s-1} + \sum_{s=k}^n s a_s^{(p)} T_i^{s-1} \right)^2$; p – номер итерации.

Для улучшения сходимости часто целесообразно использовать нормирование значений аргумента и функции или применять двухэтапный итерационный процесс (7). Для такого процесса на первом этапе

определяются начальные значения $a_k^*(k = \overline{0, n})$ из системы линейных уравнений (7) при $\alpha=1, \beta=0$. Второй же этап ($\beta \neq 0$) позволяет скорректировать решение с учетом минимизации кривизны полинома (5).

Значения коэффициентов α и β в (1) – (7) выбираются исходя из кривизны аппроксимируемой кривой $f(\cdot)$. Если принять $\alpha=1$, то чем больше кривизна, тем меньшим следует выбирать значение весового коэффициента β . В ряде случаев для усиления влияния второй части критерия (1) можно рекомендовать использовать требование $k_i^* \rightarrow 0$.

В отдельных случаях практический интерес имеют отрицательные значения коэффициентов β , влияющие на увеличение кривизны аппроксимирующей зависимости $g(\cdot)$. Иногда удобно применять частные значения коэффициентов α и β для отдельных участков функции $f(\cdot)$ из интервала аппроксимации $[T_1, T_m]$ (4) –

$$\begin{aligned} & \sum_{i=1}^m \left\{ \alpha_i [g(\tilde{a}, T_i) - f_i] \frac{\partial g(\tilde{a}, T_i)}{\partial a_k} + \right. \\ & + \beta_i \left[\frac{\partial^2 g(\tilde{a}, T_i)}{\partial T^2} - k_i A_i^{3/2} \right] \left[\frac{\partial^3 g(\tilde{a}, T_i)}{\partial T^2 \partial a_k} A_i - 3 \frac{\partial^2 g(\tilde{a}, T_i)}{\partial T^2} \times \right. \\ & \left. \times \frac{\partial^2 g(\tilde{a}, T_i)}{\partial T \partial a_k} \frac{\partial g(\tilde{a}, T_i)}{\partial T} \right] / A_i^4 \right\} = 0, \quad k = \overline{0, n}, \end{aligned}$$

где α_i и β_i ($i = \overline{1, m}$) – соответствующие весовые коэффициенты.

Простым примером, иллюстрирующим особенности предложенного подхода, может служить процесс аппроксимации зависимости времени задержки распространения $\tau_{3d,p}^{0,1}$ от температуры T для элемента ЭСЛ при построении их термозависимых макромоделей для функционально-логического проектирования [2]. В **таблице** приведены значения отдельных показателей аппроксимирующих полиномов, полученных на основе соотношений (7) для различных величин коэффициентов α и β ,

$$\begin{aligned} g_1(T) &= 4,458196 - 5,383261 \cdot 10^{-2} T + 8,282638 \cdot 10^{-4} T^2 \\ (\alpha_1 &= 1; \beta_1 = 0; S_{\varepsilon 1} = 14,925 \cdot 10^{-1}; S_{k1} = 11,54 \cdot 10^{-3}); \\ g_2(T) &= 4,483670 - 4,841437 \cdot 10^{-2} T + 7,484431 \cdot 10^{-4} T^2 \\ (\alpha_2 &= 1; \beta_2 = 10^4; S_{\varepsilon 2} = 11,5536 \cdot 10^{-1}; S_{k2} = 10,45 \cdot 10^{-3}); \\ g_3(T) &= 4,591148 - 2,555604 \cdot 10^{-2} T + 4,116535 \cdot 10^{-4} T^2 \\ (\alpha_3 &= 1; \beta_3 = 10^5; S_{\varepsilon 3} = 14,760 \cdot 10^{-1}; S_{k3} = 57,58 \cdot 10^{-4}), \end{aligned} \quad (8)$$

где $g_i(\cdot)$ определены в наносекундах, T – в °C;

$$S_{\varepsilon i} = \sum_{s=1}^m |\varepsilon_{is}| = \sum_{s=1}^m |g_i(T_s) - f_s|;$$

$$S_{ki} = \sum_{s=1}^m |k_i(T_s)| = \sum_{s=1}^m \left| \frac{\partial^2 g_i(T_s)}{\partial T^2} \left[1 + \left(\frac{\partial g_i(T_s)}{\partial T} \right)^2 \right]^{-3/2} \right|, \quad i = \overline{1, 3}.$$

Здесь (8) $S_{\varepsilon i}$ – сумма модулей отклонений аппроксимируемой и аппроксимирующей функций; S_{ki} – сумма модулей кривизны аппроксимирующей функции.

ЭЛЕКТРОННАЯ АППАРАТУРА: ИССЛЕДОВАНИЯ, РАЗРАБОТКИ

<i>S</i>	<i>T_s</i>	<i>f_s</i>	ε_{1s}	ε_{2s}	ε_{3s}	<i>k_{1s}</i>	<i>k_{2s}</i>	<i>k_{3s}</i>
1	-10	5,2	$1,21 \cdot 10^{-1}$	$1,57 \cdot 10^{-1}$	$3,12 \cdot 10^{-1}$	$1,64 \cdot 10^{-3}$	$1,49 \cdot 10^{-3}$	$8,22 \cdot 10^{-4}$
2	0	4,3	$-1,58 \cdot 10^{-1}$	$-1,84 \cdot 10^{-1}$	$-2,91 \cdot 10^{-1}$	$1,65 \cdot 10^{-3}$	$1,49 \cdot 10^{-3}$	$8,23 \cdot 10^{-4}$
3	10	4,2	$1,97 \cdot 10^{-1}$	$1,26 \cdot 10^{-1}$	$-1,77 \cdot 10^{-1}$	$1,65 \cdot 10^{-3}$	$1,49 \cdot 10^{-3}$	$8,23 \cdot 10^{-4}$
4	30	4,1	$5,11 \cdot 10^{-1}$	$3,95 \cdot 10^{-1}$	$-9,50 \cdot 10^{-2}$	$1,66 \cdot 10^{-3}$	$1,50 \cdot 10^{-3}$	$8,23 \cdot 10^{-4}$
5	50	4,2	$3,63 \cdot 10^{-1}$	$2,66 \cdot 10^{-1}$	$1,42 \cdot 10^{-1}$	$1,65 \cdot 10^{-3}$	$1,50 \cdot 10^{-3}$	$8,23 \cdot 10^{-4}$
6	60	4,3	$9,00 \cdot 10^{-2}$	$2,68 \cdot 10^{-2}$	$-2,40 \cdot 10^{-1}$	$1,65 \cdot 10^{-3}$	$1,49 \cdot 10^{-3}$	$8,23 \cdot 10^{-4}$
7	80	5,4	$-5,25 \cdot 10^{-2}$	$-5,57 \cdot 10^{-4}$	$2,19 \cdot 10^{-1}$	$1,64 \cdot 10^{-3}$	$1,49 \cdot 10^{-3}$	$8,21 \cdot 10^{-4}$

Как следует из таблицы, кривизна первого аппроксимирующего полинома (8), в котором она не минимизирована, вдвое больше кривизны третьего полинома $g_3(\cdot)$, что привело к погрешности $g_1(\cdot)$ более 0,5 нс в рабочем диапазоне температур ($T \in [20^\circ\text{C}, 40^\circ\text{C}]$). Кроме того, приведенные данные иллюстрируют тот факт, что с ростом β уменьшается отклонение аппроксимирующего полинома от заданных значений S_{ε_i} и уменьшается кривизна функции $g_i(\cdot)$ (S_{k_i}).

Таким образом, предложенный метод гладкой кривой позволяет аппроксимировать характеристики макромоделей электронных устройств с требуемой точностью и ограниченной кривизной, что дает возможность повысить эффективность автоматизированного схемотехнического проектирования электронной аппаратуры.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Николаенко В. М. Термофункциональное гипермоделирование нелинейных электронных схем. – Л.: Энергоатомиздат, 1988.
2. Николаенко О. В. Термозависимые макромодели для функционально-логического проектирования электронной аппаратуры // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 1999. – № 2 – 3. – С. 49 – 52.
3. Автоматизация схемотехнического проектирования / В. Н. Ильин, В. Т. Фролкин, А. И. Бутко и др. – М.: Радио и связь, 1987.
4. Самарский А. А., Гулин А. В. Численные методы. – М.: Наука, 1989.
5. Николаенко В. М., Логвинов О. В. Сглаженная сплайн-аппроксимация при обобщенном макромоделировании // Известия вузов. Радиоэлектроника. – 1988. – № 9. – С. 69 – 71.
6. Николаенко О. В. Полиномиальная аппроксимация функциональных зависимостей со сглаживающим дополнением // Тр. Одес. политехнического ун-та. – 1998. – Вып. 2(6). – С. 140 – 142.
7. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников. – М.: Наука., 1973.

ПОДПИСКА 2001

ЖУРНАЛ «ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. ЭЛЕКТРОНИКА»

издается с 1996 г., выходит 6 раз в год.

Вы можете оформить подписку в любом почтовом отделении по каталогу Агентства «Роспечать» (на Украине – по Каталогу зарубежных видань). Подписной индекс 47570. Для оформления подписки через редакцию необходимо:

- перечислить соответствующую сумму по банковским реквизитам получателя (Московского государственного института электронной техники) с пометкой «Оплата за журнал «Известия вузов. Электроника»;
- направить в редакцию копию платежного поручения с отметкой банка вместе с письмом-заявкой.

Стоимость подписки, включая доставку:

на 12 мес. – 780 руб.; на 6 мес. – 390 руб.; на 1 номер – 130 руб.

Наши банковские реквизиты:

ИНН 7735041133, МИЭТ, 103498, г. Москва, Зеленоград, МИЭТ,
р/с 40503810500112000001 в КБ «СДМ-БАНК»
к/с 3010181060000000685 в отделении № 1 ГУ Банка России
по г. Москве, БИК 044583685.

В редакции можно приобрести номера журнала за прошлые годы.

103498, Москва, Зеленоград, МИЭТ, редакция журнала
«Известия вузов. Электроника», комн. 7232.

Тел. редакции (095) 534-62-05

E-mail: magazine@rnd.miee.ru

